## SEMI-CONDUCTEUR À L'ÉQUILIBRE THERMODYNAMIQUE

# Semi-conducteur à l'équilibre thermodynamique

C'est quoi l'équilibre?

- Pas de forces extérieures:

- Pas de tension appliquée
- · Pas de champ magnétique
- Pas de gradient de température

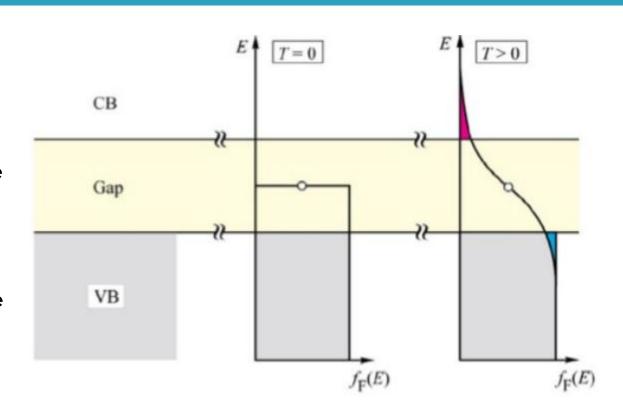
## Questions:

 Combien d'électrons existe-t-il dans la bande de conduction?

-Combien de trous existe-t-il dans la -bande de valence?

## Répartition des porteurs dans un semiconducteur

Distribution des électrons dans la bande de conduction (BC) et bans la bande de valence (BV) et distribution de fermi dans un semiconducteur intrinsèque à T=0 et T>0



## Question: Combien d'électrons dans la bande de conduction?

$$n = \int_{E_C}^E g_C(E) f(E) dE$$

$$\int_{g(E)}^E \int_{g(E)}^{g(E)} f(E) \int_{g(E)}^{g(E)} f(E) \int_{g(E-E_F)/kT}^{g(E)} f(E)$$

Or cette expression n'est valable qu'au voisinage des extremums  $(E_c)$ .

$$n = \int_{E_C}^{E} g_C(E) f(E) dE$$

$$n = \int_{E_C}^{E} \frac{1}{4\pi^2} \cdot \left(\frac{2m_C^*}{\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{(E - E_C)^{1/2}}{e^{(E - E_F)/kT} + 1} dE$$

#### Dans le cas d'un semiconducteur non dégénéré

Le niveau de Fermi se trouve dans la bande interdite

$$E_C - E_F >> kT \quad et \quad E_F - E_V >> kT$$

$$\Rightarrow E - E_F = E - E_C + \underbrace{E_C - E_F}_{>>kT} >> kT$$

$$e^{(E - E_F)/kT} >> 1 \quad \Rightarrow f(E) = \frac{1}{e^{(E - E_F)/kT} + 1} \approx e^{-(E - E_F)/kT}$$
C'est l'approximation de Boltzmann

C'est l'approximation de Boltzmann

#### Après un calcule (voir TD) on trouve

$$n = N_C e^{(E_F - E_C)/kT}$$

n est la densité des électrons dans la bande de conduction (cm<sup>-3</sup>)

Nc est appelée densité effective d'état, elle varie typiquement de  $10^{17} \text{cm}^{-3}$  à  $10^{19} \text{cm}^{-3}$ 

## Question: Combien de trous dans la bande de valence?

$$p = \int_{E}^{E_{V}} g_{V}(E) \underbrace{\left[1 - f(E)\right]} dE$$

$$g_{V}(E) = \frac{1}{4\pi^{2}} \cdot \left(\frac{2m_{V}^{*}}{\hbar^{2}}\right)^{3/2} (E_{V} - E)^{1/2}$$
Or cette expression n'est valable qu'au voisinage des extremums (E<sub>V</sub>)

$$e^{(E-E_F)/kT} + 1$$

$$= \frac{1}{e^{(E_F-E)/kT} + 1}$$

Probabilité d'occupation

des trous

$$p = \int_{E}^{E_{V}} g_{V}(E) [1 - f(E)] dE$$

$$p = \int_{E}^{E_{V}} \frac{1}{4\pi^{2}} \cdot \left(\frac{2m_{V}^{*}}{\hbar^{2}}\right)^{3/2} \frac{(E_{V} - E)^{1/2}}{e^{(E_{F} - E)/kT} + 1} dE$$

#### Après un calcul (voir TD) on trouve

$$p = N_V e^{(E_V - E_F)/kT}$$

p est la densité des trous dans la bande de valence (cm<sup>-3</sup>)

Nv est appelée densité effective d'état, elle varie typiquement de  $10^{17}$ cm<sup>-3</sup> à  $10^{19}$ cm<sup>-3</sup>

#### Résumé

- Dans ces conditions (Boltzmann), la densité de porteurs libres s'écrit:
  - Dans la bande de conduction (électrons):

$$n = N_C \exp(-\frac{E_C - E_F}{kT})$$

avec

$$N_C = 2 \left(\frac{2m_C^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

Dans la bande de valence (trous):

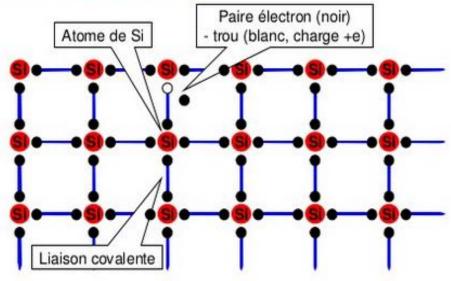
$$p = N_{v} \exp(-\frac{E_{F} - E_{v}}{kT})$$

avec

$$N_v = 2 \left(\frac{2m_v^* kT}{h^2}\right)^{3/2}$$

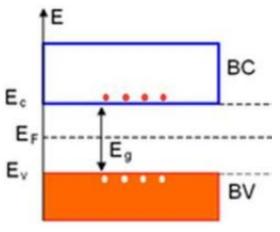
## Semi-conducteur intrinsèque

 Un semi-conducteur intrinsèque est un SC pur qui ne possède aucun atome étranger. En se libérant, l'électron laisse une place vide sur la couche périphérique de son atome : le trou.



Concentration des atomes de Si : environ 1023 atomes/cm3.

- A 0 K : bande de valence pleine et bande de conduction vide ⇒ les semi-conducteurs intrinsèques sont des isolants à 0K
- Si Taugmente : des e passent de BV à BC
- Chaque électron de la BC vient de la BV en laissant un trou



 Dans un semi-conducteur intrinsèque, la densité de trous est égale à la densité d'électrons:

$$n = p = n_i$$

$$n = n_i \equiv N_c e^{(E_F - E_c)/kT} = N_c e^{(E_i - E_c)/kT} \qquad \text{avec} \qquad N_c = \frac{1}{2\pi^{3/2}} \left(\frac{2m_c^* kT}{\kappa^2}\right)^{N_2}$$

$$p = n_i \equiv N_v e^{(E_v - E_F)/kT} = N_v e^{(E_v - E_i)/kT} \qquad \text{avec} \qquad N_v = \frac{1}{2\pi^{3/2}} \left(\frac{2m_v^* kT}{\kappa^2}\right)^{N_2}$$

#### Loi d'action de masse

$$n \cdot p = n_i^2 = N_C N_V e^{-E_g/kT} = cte$$

#### **Exercice:**

Calculer n<sub>i</sub> pour le Si à 300K: 
$$n_i = 2\left(\frac{2\pi kT}{h^2}\right)^{3/2} \left(m_n^* m_p^*\right)^{3/4} e^{-Eg/2kT}$$

$$\begin{split} n_i &= 2 \left( \frac{2\pi \times 1.38 \times 10^{-23} J / K \times 300 K}{(6.63 \times 10^{-34} J - s)^2} \right)^{\frac{3}{2}} \left( 1.1 \times 0.56 \times 9.11 \times 10^{-31} kg^2 \right)^{\frac{3}{4}} e^{-\frac{1.11}{2 \times 0.0259}} \\ n_i &= 2 \left( 5.91771 \times 10^{46} / J - s^2 \right)^{\frac{3}{2}} \left( 5.112 \times 10^{-61} kg^2 \right)^{\frac{3}{4}} e^{-21.236} \\ n_i &= 2 \times 1.4396 \times 10^{70} \frac{1}{kg^{3/2} m^3} \times 6.04593 \times 10^{-46} kg^{3/2} \times 5.99143 \times 10^{-10} \\ n_i &= 1.043 \times 10^{16} m^{-3} \end{split}$$

$$n_i = 1.043 \times 10^{10} \, cm^{-3}$$

□ En faisant n=p, on obtient le niveau de Fermi intrinsèque:

$$E_i = E_{Fi} = \frac{E_C + E_V}{2} - \frac{kT}{2} \ln(\frac{N_C}{N_V})$$

Compte-tenu du fait que d'une part  $N_C$  et  $N_V$  sont de même ordre de grandeur et d'autre part KT est petit devant les énergies des bandes on peut simplifier cette dernière équation est considérer que:

$$E_F \cong \frac{E_C + E_V}{2}$$
 ----- $E_F$ 

□ En définit un nouveau niveau d'énergies de référence le niveau de fermi intrinsèque noté  $E_i$  qui correspond au milieu de la bande interdite. Ainsi pour un semi-conducteur intrinsèque  $E_F \cong E_i$ 

$$n=N_ce^{-rac{E_C-E_i}{KT}}e^{-rac{E_i-E_F}{KT}}$$
 et  $p=N_Ve^{-rac{E_i-E_V}{KT}}e^{-rac{E_F-E_i}{KT}}$ 

$$n = n_i e^{-rac{E_i - E_F}{KT}}$$
 avec  $n_i = N_c e^{-rac{E_C - E_i}{KT}}$ 

$$p = n_i e^{-\frac{E_F - E_i}{KT}} \qquad \qquad n_i = N_V e^{-\frac{E_i - E_V}{KT}}$$

#### Semiconducteurs intrinsèques

- Désavantages des semiconducteurs intrinsèques:
  - faible conductivité à basse température;
  - la conductivité dépend fortement de la température.

- □ Il faut chercher un moyen pour surmonter ces problèmes
- C'est le dopage!!!

#### Semiconducteurs dopés

- On fera intervenir le dopage pour augmenter la concentration des porteurs et ainsi s'affranchir de la dépendance en température.
- L'introduction de dopants va permettre de changer et surtout contrôler les propriétés électriques du SC
- L'introduction d'impuretés (dopants) qui vont modifier la relation n = p:
  - Impuretés de type donneur ⇔ n > p ⇔ type n
  - Impuretés de type accepteur ⇔ p > n ⇔ type p

## Semi-conducteur extrinsèque

Un semi-conducteur extrinsèque est un semi-conducteur dopé. Les propriétés électriques d'un cristal semi-conducteur sont profondément modifiées si l'on remplace certains atomes du réseau par des atomes ayant, par rapport à l'atome substitué, un électron de plus ou en moins dans son cortège électronique.

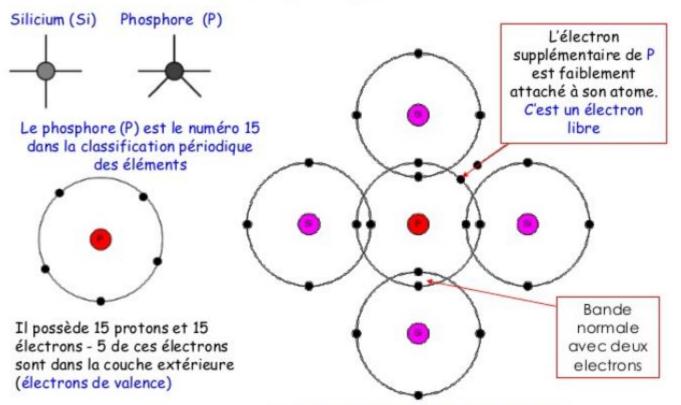
## Semi-conducteur type N

Type n: insertion d'atomes possédants 5 électrons de valence dans le réseau cristallin du Si, l'électron excédant se libère facilement pour la bande de conduction, le dopage produit ainsi des porteurs de charge négative (électrons), d'où dopage de type n.

	ША	IVA	VA	VIA
	В	C	N	0
нв	Al	Si 14	P 15	S 16
Zn	Ga	Ge	As	Se <sup>34</sup>
Cd <sup>48</sup>	In	Sn⁵	Sb	Te

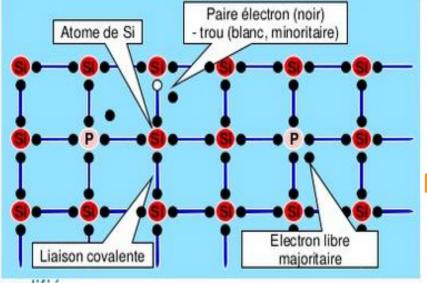
Silicium Dopants "Donneurs"

#### Le phosphore



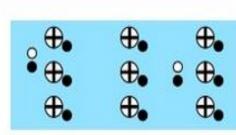
Le Phosphore est lié dans le silicium

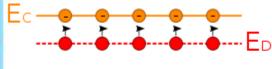
#### Représentation à plat



#### Représentation simplifiée

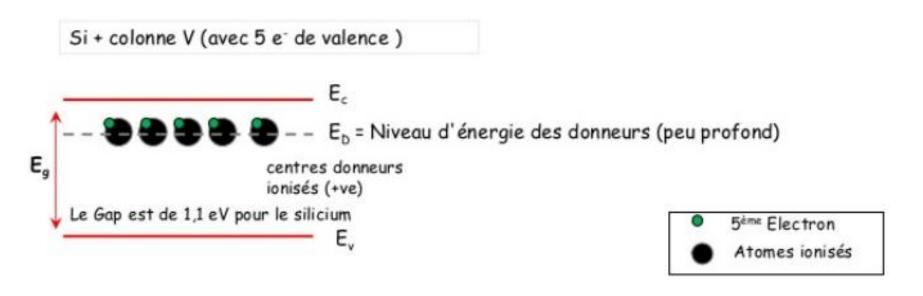
- Paires électrons-trous du Si
- Electron libres du donneur
- ⊕ Donneur = Ion positif





Ev -----

## Niveaux d'énergie des impuretés



Semiconducteur type-n

### Niveaux d'énergie des impuretés

#### Exemples

• Ge: 
$$m_e^* = 0.04 m_0$$
;  $\frac{\mathcal{E}_{SC}}{\mathcal{E}_0} = 16$   $\Rightarrow$   $E_D = -2.1 \,\mathrm{meV}$  (avec 1 meV = 10<sup>-3</sup> eV)

• GaAs: 
$$m_e^* = 0.067 m_0$$
;  $\frac{\mathcal{E}_{SC}}{\mathcal{E}_0} = 13$   $\Rightarrow$   $E_D = -5.4 \text{meV}$ 

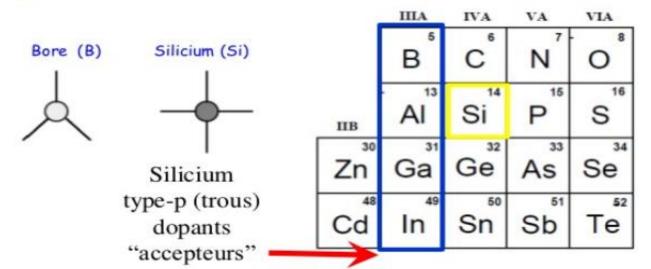
• Si: 
$$m_e^* = 0.26 m_0$$
;  $\frac{\mathcal{E}_{SC}}{\mathcal{E}_0} = 12$   $\Rightarrow$   $E_D = -25 \text{meV}$ 

• ZnSe: 
$$m_e^* = 0.21 m_0$$
;  $\frac{\mathcal{E}_{SC}}{\mathcal{E}_0} = 9$   $\Rightarrow$   $E_D = -35 \text{meV}$ 

## Semi-conducteur type P

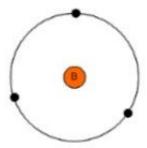
Type P: insertion d'atomes possédants 3 électrons de valence dans le réseau cristallin du Si.

Un lien laissé vacant est rempli par un électron de l'atome de Si voisin, ce qui créé un trou dans la bande de valence. Le dopage produit des porteurs chargés positivement (trous), d'où dopage de type P.



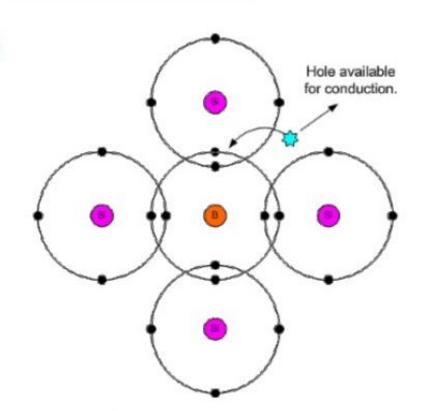
#### L'atome de bore

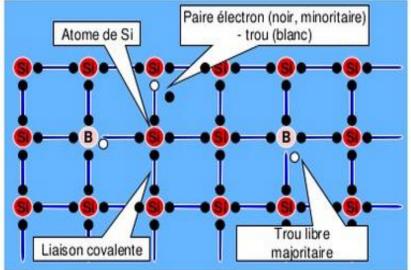
Le Bore (B) est le numéro 5 dans le tableau périodique



Il dispose de 5 protons et 5 électrons.

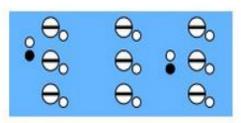
3 de ces électrons sont dans sa couche externe



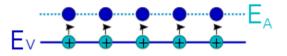


#### Représentation simplifiée

- Paires électrons-trous du Si
- O Trous libres du donneur
- Accepteur = Ion négatif







## Densité de porteurs extrinsèques

nb d'électrons différents du nb de trous

$$n-p = \Delta n \neq 0$$

Mais loi d'action de masse toujours valable, avec n.p=cte (sauf si dopage trop élevé).

$$n.p = n_i^2 = cste$$

 Pour déterminer ces concentrations (n et p), on écrit la neutralité électrique du système.

$$n + N_A = p + N_D$$
  $n^2 - (N_D - N_A)n - n_i^2$ 



$$n^2 - (N_D - N_A)n - n_i^2$$

#### Semi-conducteurs type $n (N_D > N_A)$ :

$$n - p = N_d$$

$$n - \frac{n \cdot p = n_i^2}{n} \qquad n - \frac{n_i^2}{n} = N_d$$

$$n = \frac{\sqrt{N_d^2 + 4n_i^2 + N_d}}{2} \approx N_d$$

$$n = N_C e^{-(E_C - E_F)/kT}$$

$$E_C - E_F = kT \quad \ln\left(N_C/N_D\right)$$



$$E_F = E_C + KT \ln \frac{N_D}{N_C}$$

#### Semi-conducteurs type $P(N_D < N_A)$ :

$$p - n = N_a \qquad p - \frac{n_i^2}{p} = N_a$$

$$p = \frac{\sqrt{N_a^2 + 4n_i^2 + N_a}}{2} \approx N_a$$

$$p = N_v e^{-(E_V - E_F)/kT}$$

$$E_F = E_V + KT \ln \frac{N_V}{N_c}$$

□ Au lieu d'exprimer  $E_f$  en fonction de  $N_c$  et  $N_v$ , on peut écrire:

#### type n

$$E_f - E_i = kT \ln \left( \frac{N_d}{n_i} \right)$$

type p

$$E_i - E_f = kT \ln \left( \frac{N_a}{n_i} \right)$$

### Effet de la température sur le semi-conducteur

#### Semi-conducteurs type n:

Lorsque la température du semi-conducteur est abaissée les densités des donneurs ou d'accepteur ionisé diminuent progressivement de même que les densités des porteurs libres. La densité de donneurs ionisé est donnée par:

$$N_D^+ = \frac{N_D}{1 + g \cdot \exp{-\frac{E_D - E_F}{kT}}} \approx \frac{1}{1 + \exp{\left(-\frac{E_D - E_F}{kT}\right)}} = N_D \times f_p(E_D)$$

#### Variation de la conduction d'un semiconducteur dopé en fonction de la température

